

Technical-News

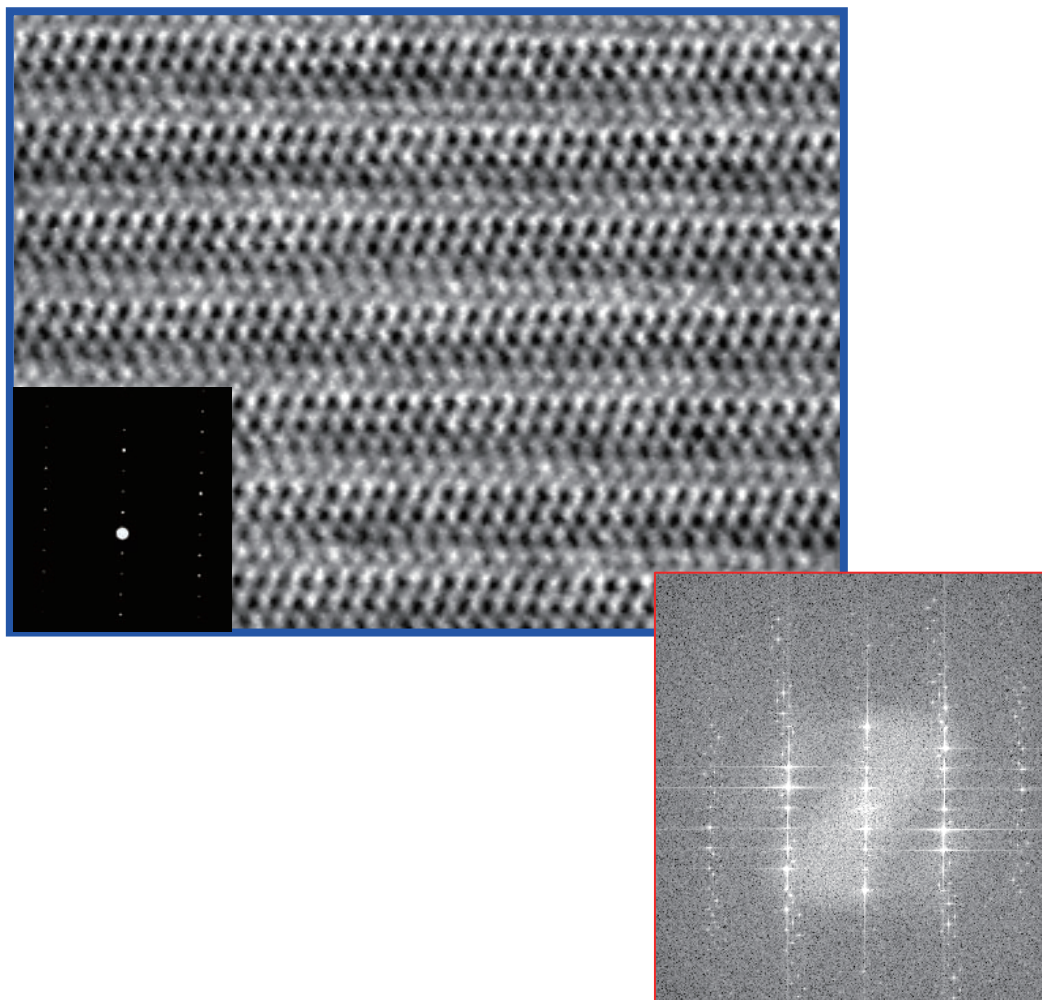
SiC(4H)の HR-TEM 観察

TEM-07

株式会社イオンテクノセンター

材料評価にはナノスケールのレベルで構造を観察できる透過型電子顕微鏡 (TEM) が不可欠です。

ここでは SiC (4H) 基板を HRTEM (JEOL-4000EX) により観察した例を紹介합니다。C 軸の長さが 1nm である 4 層の長周期構造が高分解能で観察されています。また高分解能 TEM 像に FFT (高速フーリエ変換) 処理を施すことによって逆格子空間における情報を引き出すことができます。逆格子空間におけるダイレクトスポットと回折スポットとの距離は結晶構造から求めることができるため、逆格子空間と実空間との変換係数を基にして測長を正確に行なうことができます。



お問合せ窓口

イオンテクノセンター技術営業部
E-mail : info@iontc.co.jp

TEL:072-859-6601 / FAX:072-859-5770
URL : <http://www.iontc.co.jp>